09789044

PCT/JP00/09139

日本国特許庁

EU

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

1700/9139

22.12.00

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1999年12月24日

REC'D 2-3 FEB 2001

WIPO

PCT

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第367209号

出 類 人 Applicant (s):

アンリツ株式会社



PRIORITY
DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
GOMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2001年 2月 9日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 及川耕



特平11-36720

【書類名】

特許願

【整理番号】

101413

【あて先】

特許庁長官殿

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区南麻布五丁目10番27号 アンリツ株式会

社内

【氏名】

望月 健

【発明者】

【住所又は居所】

東京都港区南麻布五丁目10番27号 アンリツ株式会

社内

【氏名】

内野 政治

【特許出願人】

【識別番号】

000000572

【氏名又は名称】

アンリツ株式会社

【代表者】

中川 裕雄

【代理人】

【識別番号】

100079337

【弁理士】

【氏名又は名称】

早川 誠志

【電話番号】

03-3490-4516

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

043443

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9712293

【プルーフの要否】

要



明細書

【発明の名称】

雑音発生装置およびジッタ・ワンダ発生装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ディジタルの白色性の雑音信号を発生する白色雑音発生手段と、

る周波数特性の雑音信号に変換して出力するフィルタ部と、

ディジタル信号を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶し、該複数 の記憶素子の記憶内容についての積和演算を行うディジタルフィルタを有し、前 記白色雑音発生手段から出力された雑音信号を予め設定された特性係数に対応す

前記フィルタ部に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手段と、

前記フィルタ部から前記特性係数に対応した周波数特性の雑音信号が出力されている状態における前記ディジタルフィルタの各記憶素子の記憶内容と同等の雑音信号列を、少なくとも装置の動作初期時に前記ディジタルフィルタの各記憶素子に初期設定する初期設定手段とを備えた雑音発生装置。

【請求項2】

ディジタルの白色性の雑音信号を発生する白色雑音発生手段と、

ディジタル信号を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶し、該複数の記憶素子の記憶内容についての積和演算を行うディジタルフィルタを有し、前記自色雑音発生手段から出力された雑音信号を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出力するフィルタ部と、

前記フィルタ部に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手段と、

前記フィルタ部から出力される雑音信号に予め設定された振幅係数を乗算する 乗算器と、

前記乗算器に任意の振幅係数を設定する振幅設定手段と、

前記特性係数設定手段から前記フィルタ部に設定された特性係数および振幅設定手段の振幅係数とに基づいて、前記乗算器から出力される雑音信号の特性を求める特性算出手段と、

前記特性算出手段によって求められた雑音信号の特性を表示する特性表示手段 とを備えた雑音発生装置。



ディジタルの白色性の雑音信号を発生する白色雑音発生手段と、

ディジタル信号を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶し、該複数の記憶素子の記憶内容についての積和演算を行うディジタルフィルタを有し、前記白色雑音発生手段から出力された雑音信号を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出力するフィルタ部と、

前記フィルタ部に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手段と、

前記フィルタ部から出力される雑音信号に予め設定された振幅係数を乗算する 乗算器と、

前記乗算器に任意の振幅係数を設定する振幅設定手段と、

前記乗算器から出力された雑音信号によって位相変調されたクロック信号を出力する周波数シンセサイザと、

前記フィルタ部から前記特性係数に対応した周波数特性の雑音信号が出力されている状態における前記ディジタルフィルタの各記憶素子の記憶内容と同等の雑音信号列を、少なくとも装置の動作初期時に前記ディジタルフィルタの各記憶素子に初期設定する初期設定手段とを備えたジッタ・ワンダ発生装置。

【請求項4】

ディジタルの白色性の雑音信号を発生する白色雑音発生手段と、

ディジタル信号を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶し、該複数の記憶素子の記憶内容についての積和演算を行うディジタルフィルタを有し、前記白色雑音発生手段から出力された雑音信号を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出力するフィルタ部と、

前記フィルタ部に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手段と、

前記フィルタ部から出力される雑音信号に予め設定された振幅係数を乗算する 乗算器と、

前記乗算器に任意の振幅係数を設定する振幅設定手段と、

前記乗算器から出力された雑音信号によって位相変調されたクロック信号を出力する周波数シンセサイザと、

前記特性係数設定手段から設定された特性係数および振幅設定手段から設定さ

れた振幅係数に基づいて、前記乗算器から出力される雑音信号または前記周波数 シンセサイザから出力されるクロック信号の特性を求める特性算出手段と、

前記特性算出手段によって求められた特性を表示する特性表示手段とを備えたジッタ・ワンダ発生装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、所望特性の雑音信号や位相揺らぎ信号を速やかに発生し、また、発生する信号の特性を事前に確認できるようにするための技術に関する。

[0002]

【従来の技術】

例えば、ディジタル信号を通信するシステムでは、ディジタル信号の位相の揺らぎ (ジッタやワンダ) による通信品質の低下が問題となる。

[0003]

このため、従来では、通信システムあるいはこのシステムを構成する機器のディジタル信号の位相揺らぎに対する耐力等を測定している。

[0004]

このような測定を実際の動作状態に近い状態で行うために、従来では、雑音発生装置から出力された雑音信号でクロック信号を位相変調し、このクロック信号 に同期したディジタル信号を測定対象の通信システムや機器に入力して、通信システムや機器の符号誤り率等を測定していた。

[0005]

このような目的で使用される雑音発生装置として近年ではアナログ方式のもの に代わってディジタル式のものが用いられている。

[0006]

ディジタル式の雑音発生装置として、従来では、予めメモリに記憶されている 雑音信号の波形データを読み出して出力する構成のものや、複数段のシフトレジ スタの所定段の出力の排他的論理和を初段に帰還することで擬似ランダム信号を 発生する複数の擬似ランダム発生器の出力を合成して出力する構成のものがあっ



[0007]

ところが、メモリに記憶されている雑音信号の波形データを読み出して出力する構成のものでは、波形の最大周期がメモリの容量に依存し、出力できる雑音信号の低周波成分がメモリの容量で制限されてしまい、例えば、10Hz以下の位相揺らぎ(ワンダ)を生成するためには膨大な容量のメモリが必要になってしまう。

[0008]

また、複数の擬似ランダム信号発生器から出力される擬似ランダム信号を合成 するものでは、各擬似ランダム信号発生器の段数を大きくすることで低い周波数 成分の雑音信号を発生できるが、この構成のものでは振幅がガウス分布にしたが う白色雑音に近似した特性の雑音しか発生できず、所望の位相揺らぎ特性を与え ることができない。

[0009]

これを解決するために、図10に示すように、雑音発生器11から出力される 白色性の雑音信号をディジタルフィルタ12に入力し、このディジタルフィルタ 12のフィルタ係数をフィルタ係数設定手段13によって可変制御して、任意の 周波数特性の雑音信号をディジタルフィルタ12から出力させることが考えられ る。

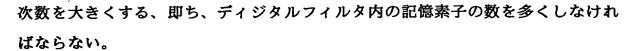
[0010]

なお、ディジタルフィルタ12は、一般に、入力信号を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶するとともに、各記憶素子の内容と各記憶素子に対応 したフィルタ係数との積和演算を行い、その演算結果を順次出力する構成を有し ており、フィルタ係数を可変することで、フィルタの周波数特性を可変できるようになっている。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、ディジタルフィルタ12に任意の周波数特性をもたせるために は、設定できる周波数分解能を高くする必要があり、そのためには、フィルタの



[0012]

ところが、このようにディジタルフィルタ内の記憶素子の数を多くした場合、 動作初期時や特性の切り換え時に、所望特性の雑音信号が出力されるまでの時間 が非常に長くなるという問題があった。_

[0013]

例えば、動作初期時には、ディジタルフィルタ12内の各記憶素子の記憶値が 0にリセットされており、雑音信号がこれらの記憶素子の数だけ入力されるまで の間、ディジタルフィルタ12からは所望特性と全く異なる特性の雑音信号が出 力されることになり、前記のように内部の記憶素子の数が多いと、この待ち時間 が非常に長くなってしまう。

[0014]

一方、このように出力する雑音信号の特性を任意に可変できるようにした場合、雑音発生装置から実際に出力される雑音信号や、この雑音発生装置を用いてジッタやワンダを発生する装置から実際に生成されるクロック信号の特性がどのような特性であるかを確認できないと不便である。

[0015]

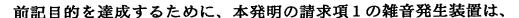
これを解決するために、ディジタルフィルタ12から出力される雑音信号や、その雑音信号に基づいて生成されるクロック信号の特性を測定し、その測定結果を表示することも考えられるが、このように雑音信号やクロック信号を実際に測定する方法では、雑音発生装置やこれを用いたジッタ・ワンダ発生装置の構成が複雑化するとともに、測定する特性の内容によっては測定が完了するまで非常に時間(数時間~数十日)がかかってしまい、実現が困難である。

[0016]

本発明は、このような問題を解決した雑音発生装置およびジッタ・ワンダ発生 装置を提供することを目的としている。

[0017]

【課題を解決するための手段】



ディジタルの白色性の雑音信号を発生する白色雑音発生手段と、

ディジタル信号を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶し、該複数の記憶素子の記憶内容についての積和演算を行うディジタルフィルタを有し、前記白色雑音発生手段から出力された雑音信号を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出力するフィルタ部と、

前記フィルタ部に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手段と、

前記フィルタ部から前記特性係数に対応した周波数特性の雑音信号が出力されている状態における前記ディジタルフィルタの各記憶素子の記憶内容と同等の雑音信号列を、少なくとも装置の動作初期時に前記ディジタルフィルタの各記憶素子に初期設定する初期設定手段とを備えている。

[0018]

また、本発明の請求項2の雑音発生装置は、

ディジタルの白色性の雑音信号を発生する白色雑音発生手段と、

ディジタル信号を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶し、該複数の記憶素子の記憶内容についての積和演算を行うディジタルフィルタを有し、前記白色雑音発生手段から出力された雑音信号を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出力するフィルタ部と、

前記フィルタ部に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手段と、

前記フィルタ部から出力される雑音信号に予め設定された振幅係数を乗算する 乗算器と、

前記乗算器に任意の振幅係数を設定する振幅設定手段と、

前記特性係数設定手段から前記フィルタ部に設定された特性係数および振幅設定手段の振幅係数とに基づいて、前記乗算器から出力される雑音信号の特性を求める特性算出手段と、

前記特性算出手段によって求められた雑音信号の特性を表示する特性表示手段 とを備えている。

[0019]

また、本発明の請求項3のジッタ・ワンダ発生装置は、

ディジタルの白色性の雑音信号を発生する白色雑音発生手段と、

ディジタル信号を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶し、該複数の記憶素子の記憶内容についての積和演算を行うディジタルフィルタを有し、前記自色雑音発生手段から出力された雑音信号を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出力するフィルタ部と、

前記フィルタ部に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手段と、

前記フィルタ部から出力される雑音信号に予め設定された振幅係数を乗算する 乗算器と、

前記乗算器に任意の振幅係数を設定する振幅設定手段と、

前記乗算器から出力された雑音信号によって位相変調されたクロック信号を出力する周波数シンセサイザと、

前記フィルタ部から前記特性係数に対応した周波数特性の雑音信号が出力されている状態における前記ディジタルフィルタの各記憶素子の記憶内容と同等の雑音信号列を、少なくとも装置の動作初期時に前記ディジタルフィルタの各記憶素子に初期設定する初期設定手段とを備えている。

[0020]

また、本発明の請求項4のジッタ・ワンダ発生装置は、

ディジタルの白色性の雑音信号を発生する白色雑音発生手段と、

ディジタル信号を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶し、該複数の記憶素子の記憶内容についての積和演算を行うディジタルフィルタを有し、前記自色雑音発生手段から出力された雑音信号を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出力するフィルタ部と、

前記フィルタ部に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手段と、

前記フィルタ部から出力される雑音信号に予め設定された振幅係数を乗算する 乗算器と、

前記乗算器に任意の振幅係数を設定する振幅設定手段と、

前記乗算器から出力された雑音信号によって位相変調されたクロック信号を出力する周波数シンセサイザと、

前記特性係数設定手段から設定された特性係数および振幅設定手段から設定さ

れた振幅係数に基づいて、前記乗算器から出力される雑音信号または前記周波数 シンセサイザから出力されるクロック信号の特性を求める特性算出手段と、

前記特性算出手段によって求められた特性を表示する特性表示手段とを備えている。

[0021]

【発明の実施の形態】

以下、図面に基づいて本発明の実施形態を説明する。

図1は、本発明を適用した雑音発生装置20の構成を示している。

[0022]

雑音発生装置20の白色雑音発生手段21は、ディジタルの白色性の雑音信号 n(k)を所定レートで出力する。この白色雑音発生手段21は、例えば図2に示すように、複数N(例えばN=12)の擬似ランダム信号発生器22(1)~22(N)からクロック信号CKnに同期してシリアル出力される各Kビットののランダム信号を加算回路24で加算してK+[10g2N]ビットとした白色雑音信号n(k)を出力する。ここで、上記の括弧記号[]は、小数を切り上げた整数値を表す。

[0023]

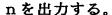
これら複数Nの擬似ランダム信号発生器 $22(1) \sim 22(N)$ は、同一のS 段シフトレジスタから生成される符号周期(2^S-1)の擬似ランダム信号を発生するものであるが、その出力の相関ピークが離間するように、制御回路23によって出力符号の位相が大きく異なるように初期設定され、n(1)、n(2)、…、 $n(2^S-2)$ 、 $n(2^S-1)$ までの雑音信号を1 周期として、これを繰り返し出力する。

[0024]

このように、複数の擬似ランダム信号を加算して生成される白色雑音信号の瞬時値はガウス分布特性に近似する。

[0025]

制御回路23は、後述の初期設定手段31からの雑音信号出力指示を受けて、 擬似ランダム信号発生器22(1)~22(N)を初期化してクロック信号CK



[0026]

白色雑音発生手段21から出力された雑音信号n(k)は、フィルタ部25に入力される。フィルタ部25は、ディジタル信号列を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶し、その複数の記憶素子の記憶内容についての積和演算を行うディジタルフィルタを有しており、白色雑音発生手段21から出力された雑音信号n(k)を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出力する。

[0027]

ここで、例えばフィルタ部25が、図3に示すようなFIR型のディジタルフィルタ26によって構成されている場合について説明する。

[0028]

このディジタルフィルタ 26 は、入力データを順次後段へシフトしながら記憶する複数M段直列の記憶素子(遅延素子ともいう) $27(1) \sim 27(M)$ と、初段の記憶素子 27(1) の入力データおよび各記憶素子 $27(1) \sim 27(M)$)の出力データに対してフィルタ係数(この実施形態の特性係数) 1000 トルグをそれぞれ乗算する乗算器 $28(1) \sim 28(M+1)$ と、乗算器 $28(1) \sim 28(M+1)$ の出力の総和を求める加算器 29 とによって構成されている。

[0029]

各記憶素子27(1)~27(M)は雑音信号n(k)をそのクロック信号C Knに同期して順次シフトさせる。また、各記憶素子27(1)~27(M)は 、後述の初期設定手段31から任意の値D(1)~D(M)をセットできるよう になっている。

[0030]

また、乗算器 $28(1)\sim 28(M+1)$ に入力されるフィルタ係数 $h_0\sim h$ M は、後述の特性係数設定手段 30 によって設定される。

[0031]

このように構成された FIR型のディジタルフィルタ 26は、入力される雑音信号n(k)をフィルタ係数 $h_O \sim h_M$ に応じた周波数特性の雑音信号に変換し



[0032]

特性係数設定手段30は、フィルタ部25から出力される雑音信号u(k)の特性を決定するための特性係数(上記のようにフィルタ部25がディジタルフィルタ26のみで構成されている場合にはそのフィルタ係数)を設定するためのものであり、図示しない操作部等の操作によって任意の特性係数を設定できるようになっている。

[0033]

初期設定手段31は、メモリ(ROM)31aを有し、フィルタ部25から特性係数に対応した周波数特性の雑音信号が出力されている状態におけるディジタルフィルタ内の各記憶素子の記憶内容と同等の雑音信号列を、メモリ31aの内容に基づいて求めて、少なくとも装置の動作初期時にディジタルフィルタ内の各記憶素子に初期設定する。

[0034]

即ち、前記のようにフィルタ部 25 がディジタルフィルタ 26 のみによって構成されているような場合には、ディジタルフィルタ 26 からフィルタ係数 $h_0 \sim h_M$ に対応した周波数特性の雑音信号が出力されている状態における各記憶素子 $27(1)\sim 27(M)$ の記憶内容と同等の雑音信号列を初期設定する。

[0035]

ここで、白色雑音発生手段 21 が動作初期時に発生する雑音信号 n (1) を既知とすれば、その雑音信号 n (1) より前のM個の雑音信号 n (2^N-1)、n (2^N-2)、…、n (2^N-M) をそれぞれ初期値 n (n (n) としてメモリ n 3 n 1 a に予め記憶しておき、電源投入等の動作初期時に、図 4 に示すように、ディジタルフィルタ n 2 6 の各記憶素子 n 2 7 (n) にそれぞれ初期設定してから、白色雑音発生手段 n 2 1 へ雑音信号の出力を指示する。

[0036]



[0037]

フィルタ部25から出力される雑音信号u(k)は、乗算器32に入力される。乗算器32は振幅設定手段33によって設定された振幅係数Aを雑音信号u(k)に乗算し、その乗算結果を所望特性の雑音信号y(k)として出力する。

[0038]

また、特性算出手段34は、フィルタ部25に設定された特性係数および乗算器32に設定された振幅係数Aとに基づいて、乗算器32から出力される雑音信号y(k)の周波数特性や振幅等を求める。

[0039]

特性表示手段35は、表示器36に特性算出手段34によって求められた雑音 信号の特性をグラフや数値で表示する。

[0040]

このように構成された雑音発生装置20では、初期設定手段31によってフィルタ部25から特性係数に対応した周波数特性の雑音信号が出力されている状態におけるディジタルフィルタ26内の各記憶素子27(1)~27(M)の記憶内容と同等の雑音信号を、少なくとも装置の動作初期時に各記憶素子27(1)~27(M)に初期設定している。

[0041]

このため、白色雑音発生手段21からM個の雑音信号がフィルタ部25に取り 込まれるまで待たなくても、直ちに特性係数に対応した周波数特性の雑音信号を フィルタ部25から出力させることができ、この特性に合わない雑音信号の出力 による測定等の影響をなくすことができる。

[0042]

また、特性算出手段34によって、特性係数設定手段30からフィルタ部25 に設定された特性係数および振幅設定手段33の振幅係数Aに基づいて、出力される雑音信号y(k)の特性を求め、その特性を特性表示手段35によって表示しているので、出力する雑音信号y(k)の特性を事前に且つ速やかに確認することができて便利である。 [0043]

前記説明では、フィルタ部25がディジタルフィルタ26のみで構成されている場合について説明したが、これは本発明を限定するものではない。

[0044]

例えば、フィルタ部25を図5に示すように、分波回路41と、重み付け回路 43と、ディジタルフィルタを含む合成回路45とで構成することも可能である

[0045]

分波回路41は、複数Pの1/2デシメート回路42(1)~42(P)がカスケード接続されて構成されている。

[0046]

各1/2デシメート回路42(1)~42(P)は、入力データされるデータを2つの出力経路に交互に振り分けて、入力レートの1/2のレートで出力する回路である。

[0047]

初段の1/2デシメート回路42(P)は、図6の(a)の雑音信号n(1)、n(2)、n(3)、…が入力されると、その一方の出力端子から、図6の(b)のように、奇数番目の雑音信号n(1)、n(3)、n(5)、…を出力し、他方の出力端子から偶数番目の雑音信号n(2)、n(4)、n(6)、…を出力する。この他方の出力端子から出力される雑音信号は、2段目の1/2デシメート回路42(P-1)に入力される。

[0048]

2段目の1/2デシメート回路42(P-1)も同様に、入力された雑音信号n(2)、n(4)、n(6)、…のうち、一方の出力端子から図6の(c)のように、雑音信号n(2)、n(6)、n(10)、…を出力し、他方の出力端子から雑音信号n(4)、n(8)、n(12)、…を出力する。この他方の出力端子から出力された雑音信号は、3段目の1/2デシメート回路42(P-2)に入力される。

[0049]

同様に、3段目の1/2デシメート回路42(P-2)の一方の出力端子からは、図6の(d)のように、雑音信号n(4)、n(12)、n(20)、…が出力され、他方の出力端子からは雑音信号n(8)、n(16)、n(24)、…が出力され、4段目の1/2デシメート回路42(P-3)の一方の出力端子からは、図6の(e)のように、雑音信号n(8)、n(24)、n(40)、…が出力され、他方の出力端子からは雑音信号n(16)、n(32)、n(5

6)、…が出力され、さらに各1/2デシメート回路 $42(P-4)\sim 42(1)$)からは、出力レートが1/2ずつ低くなるように雑音信号が出力される。

[0050]

このように、各1/2デシメート回路42(1)~42(P)の一方の出力端子から異なるレートで出力される雑音信号 n_1 、 n_2 、 n_3 、 \dots 、 n_{P+1} は、重み付け回路43の乗算器44(1)~44(P+1)にそれぞれ入力される。

[0051]

乗算器 $44(1)\sim 44(P+1)$ は、入力される雑音信号 n_1 、 n_2 、 n_3 、…、 n_{P+1} に対して、それそれ重み付け係数(特性係数) σ_1 、 σ_2 、 σ_3 …、 σ_{P+1} を乗算して出力する。

[0052]

このように各レートの雑音信号 n_1 、 n_2 、 n_3 、…、 n_{P+1} に対して重み付けを行うことで、このフィルタ部 2 5 から出力される雑音信号u (k) の周波数特性を任意に設定することができる。

[0053]

例えば、図7に示すような重み付け(この図ではPが12)を行うことで、ワンダの評価に用いる特定のTDEVマスク特性に対応した電力スペクトル密度分布の位相揺らぎをもつクロック信号を生成することができる。この際、電力スペクトル密度分布は、σの2乗値の分布に従う。

[0054]

重み付けされた各レートの雑音信号 \mathbf{n}_1 、 \mathbf{n}_2 、 \mathbf{n}_3 、 \mathbf{n}_3 、 \mathbf{n}_3 、 \mathbf{n}_{P+1} は、合成回路 $\mathbf{4}_5$ のサブバンド合成器 $\mathbf{4}_6$ (1)~ $\mathbf{4}_6$ (P)にそれぞれ入力される。



各サブバンド合成器46(1)~46(P)は、前記したFIR型で遮断周波数が共通のLPF(ローパスフィルタ)とHPF(ハイパスフィルタ)とを内部に備えており、入力される2つのディジタル信号に対してインターポーレーション処理を行い、その一方(周波数が高い方)の入力に対してHPFで低域を遮断し、他方(周波数が低い方)の入力に対してはLPFで高域を遮断して、両フィ

ルタの出力を合成して出力するように構成されている。

[0056]

サブバンド合成器 $46(1) \sim 46(P)$ の内部のフィルタの遮断周波数は、最も周波数が低いサブバンド合成器 46(1) の遮断周波数を fa とすると、 2 fa、 4 fa、 8 fa、 \cdots 、 2 P-1 fa の順に、入力する雑音信号のレートに対応して 2 倍ずつ高くなるように設定されており、レートの低い雑音信号から順に合成するように接続されている。

[0057]

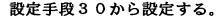
即ち、図8に示すように、最もレートの2つの低い雑音信号 n_1 '、 n_2 'はサブバンド合成器46(1)において遮断周波数faで合成され、その合成出力と雑音信号 n_3 'とがサブバンド合成器46(2)において遮断周波数2faで合成され、その合成出力と雑音信号 n_4 'とがサブバンド合成器46(3)において遮断周波数4faで合成される。

[0058]

以下同様にレートに低い雑音信号から順に合成されるため、サブバンド合成器 46 (P) からは、図8に示しているように、オクターブ幅の各帯域のレベルが 重み付け係数に応じて変化する周波数特性の雑音信号 u (k) が出力されること になる。

[0059]

このように分波回路 $4\,1$ 、重み付け回路 $4\,3$ および合成回路 $4\,5$ によって構成されたフィルタ部 $2\,5$ の場合、合成回路 $4\,5$ の各サブバンド合成器 $4\,6$ のフィルタの遮断周波数は固定であるのでフィルタ係数を可変制御する必要はなく、フィルタの特性を決定する重み付け係数 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 、 …、 σ_{P+1} を特性係数



[0060]

また、合成回路46のフィルタ(ディジタルフィルタ)内部の記憶素子に対して、初期設定手段31は、フィルタ部25から特性係数(この場合重み付け係数)に対応した周波数特性の雑音信号が出力されている状態における各記憶素子の記憶内容と同一特性の雑音信号列を、装置の動作初期時および重み付け係数変更時に初期設定する。

[0061]

ただし、この場合には、前記のように白色雑音発生手段21から出力される信号列を単純に代入できないので、白色雑音信号と特性係数設定手段30からの重み付け係数等の情報に基づいて、各フィルタの記憶素子に設定すべき初期値を算出して設定する。

[0062]

即ち、前記したように、白色雑音発生手段21が動作初期時に発生する雑音信号n(1)を既知とすれば、定常状態で白色雑音発生手段21が雑音信号n(1)を発生するときに、分波回路41から出力されている各雑音信号n₁~n_{P+1}も既知であり、また、合成回路45の各サブバンド合成器46のフィルタの特性(伝達関数)も既知である。

[0063]

また、合成回路 45 の各サブバンド合成器 46 (1) ~ 46 (P) の内部の LPFとHPFの記憶素子を前記同様にともにM段とすると、最終段のサブバンド合成器 46 (P) のフィルタの各記憶素子に正規のM個の雑音信号が入力されるのは、初段のサブバンド合成器 46 (1) に 2^P ・M個の雑音信号が入力されたときであり、このときの 1 番目 (1 は 1 \sim Pのいずれか)のサブバンド合成器 46 (1)の LPFのm段目(mは 1 \sim Mのいずれか)記憶素子の記憶値 16 (16)とHPFのm段目の記憶素子の記憶値 16 (16)とHPFのm段目の記憶素子の記憶値 16 (16)とHPFのm段目の記憶素子の記憶値 16 (16)と

$$L_{i}(m) = _{j=1} \Sigma^{i+1} \sigma_{j} \cdot x_{j}(m)$$

$$H_{i}(m) = _{j=1} \Sigma^{i+1} \sigma_{j} \cdot y_{j}(m)$$
と表される。

[0064]

ここで、 $\mathbf{x}_{\mathbf{j}}$ (m)、 $\mathbf{y}_{\mathbf{j}}$ (m)は、LPFとHPFの伝達関数と白色雑音発生手段 $\mathbf{2}$ 1 から出力される雑音信号から求まる定数列(重み付け係数を $\mathbf{1}$ としたときの定数列)であり、前記したように、LPFとHPFの伝達関数と白色雑音発生手段 $\mathbf{2}$ 2 1 から出力される雑音信号は既知である。

[0065]

したがって、定数列 $\mathbf{x}_{\mathbf{j}}$ (\mathbf{m})、 $\mathbf{y}_{\mathbf{j}}$ (\mathbf{m}) を予め求めてメモリ31 a に記憶しておき、動作初期時や重み付け係数の変更時に、上記演算によってフィルタの初期値を求めて合成回路45の各サブバンド合成器46(1)~46(P) に設定すれば、直ちに所望の特性の雑音信号 \mathbf{u} (\mathbf{k}) を出力することができる。

[0066]

上記の積和演算の総演算回数は、M [(P+1) 2 + (P+1) $^ ^2$] となり、M=24、P+1=20 の場合 10032 回となり、この積和演算は短時間に終了することができる。

[006.7]

初期設定手段31は、この演算によって得られた初期値 L_1 (1)~ L_1 (M)、 L_2 (1)~ L_2 (M)、…、 L_P (1)~ L_P (M)、 H_1 (1)~ H_1 (M)、 H_2 (1)~ H_2 (1) ~ H_2 (

[0068]

なお、この初期設定を実際に白色雑音発生手段 21 からの雑音信号の入力で行うとすれば、前記のように 2^P ・M個の雑音信号を入力する必要があり、その入力レートを 50 H z とすると約 70 時間もかかってしまう。また、仮に初期設定中のみ入力レートを上げたとしても、合成回路 45 が 2^P ・M個の雑音信号を計算するのに必要な総積和演算回数が 2 M 2 (2^P-1) であるため、前述と同様にM=24、P+1=20とした場合には、60205 倍の積和演算を必要とし、長時間を要する。

[0069]

このように、動作初期時や特性係数変更時にフィルタ部25のディジタルフィルタの各記憶素子に初期設定をすることにより、フィルタ部25の内部の状態は直ちに定常状態と同一の状態に設定されるため、フィルタ部25からは、特性係数設定手段30から設定された特性係数(この場合重み付け係数)に応じた周波数特性の雑音信号を速やかに出力させることができる。

[0070]

上記雑音発生装置21は単独で用いたり、位相揺らぎのあるクロック信号を発生する信号発生装置等の変調信号発生部として用いることができる。

[0071]

図9は、上記雑音発生装置とほぼ同一構成を用いて位相揺らぎ(ジッタまたは ワンダー)のあるクロック信号を発生するジッタ・ワンダ発生装置50の構成を 示している。

[0072]

この図において、白色雑音発生手段21、フィルタ部25、特性係数設定手段30、初期設定手段31、乗算器32および振幅設定手段33は、前記雑音発生装置20のものと同一構成なので、同一符号を付している。

[0073]

このジッタ・ワンダ発生装置50は、乗算器32の出力y(k)を周波数シンセサイザ51に入力している。

[0074]

周波数シンセサイザ51は、例えばDDS(ダイレクトディジタルシンセサイザ)やPLL発振器等で構成されており、所定の中心周波数をもち、乗算器32の出力y(k)に応じて位相が変調されたクロック信号CKを出力する。

[0075]

一方、特性算出手段34'は、特性係数設定手段30からの特性係数、振幅設定手段33の振幅係数Aおよび図示しない操作部等から設定されたパラメータに基づいて、雑音信号y(k)あるいはクロック信号CKの特性を求める。

[0076]

例えば10Hz以下の位相揺らぎであるワンダーの評価量として、TIErm

 $s(\tau)$ (Root Mean Square Time Interval Error)、ADEV(τ) (Allan Deviation)、MADE V($n\tau_0$) (Modified Allan Deviation)、TDE V($n\tau_0$) (Time Deviation)等があるが、これらを実際にクロック信号CKに対して測定して得ようとすれば、前記したように非常に長い時間(数時間以上)かかってしまう。

[0077]

そこで、このジッタ・ワンダ発生装置50では、特性算出手段34'において 上記特性を以下の演算を行って選択的に求めている。

[0078]

TIErms (τ)

$$= [8 \int S_{x} (f) \sin^{2} (\pi f \tau) df]^{1/2}$$
[0079]

ADEV (τ)

=
$$[(16/\tau^2) \int S_x(f) \sin^4(\pi f \tau) df]^{1/2}$$
[0080]

MADEV (n T 0)

= {
$$(16/(n^2\tau_0)^2)$$
 } [sin⁶ $(\pi f \tau_0)$ /sin² $(\pi f \tau_0)$ } · S_x (f) df} ^{1/2} (n=0, 1, 2, ..., N)
[0081]

TDEV (n τ_0)

$$= \{ (16/3 n^{2}) \int (\sin^{6} (\pi f \tau_{0}) / \sin^{2} (\pi f \tau_{0})) \} S_{x}$$
(f) df \} \frac{1}{2} \qquad (n = 0, 1, 2, \dots, N)

[0082]

ここで、

$$S_{v}(f)$$

= f c [(
$$\sigma_a \cdot u \cdot A$$
) sin ($\pi f/f s$) /2 $\pi f sin (\pi f/f c$)
] $^2 \cdot | H (e^{j\pi f/f s}) | ^2$
[0083]

また、記号 \int はf=0 \sim f=fhまでの積分をとるものとし、パラメータfhは雑音最大周波数、 τ は測定時間、 τ 0は測定サンプリング時間、 σ aは白色雑音の標準偏差、fsは白色雑音発生手段21のサンプリング周波数、 τ 1は周波数シンセサイザ51をDDSで構成した場合のDDSの量子化ステップ、fcは同D/Aコンバータのクロック周波数である。

[0084]

Aは振幅設定手段33からの振幅係数、 $|H(e^{j\pi f/f s})|$ は、特性係数設定手段31から設定された特性係数に基づいて算出される周波数特性、 S_x (f)は特性係数設定手段31から設定された特性係数に基づいて算出される時間誤差のパワースペクトルである。

[0085]

このような演算によって得られた特性は、特性表示手段35によって表示器36に数値あるいはグラフで表示されるが、上記演算は、実際のクロック信号を測定せずに、特性係数、振幅係数および前記パラメータに基づいて算出しているので、短時間に求めることができ、信号を出力させるときに事前に雑音特性やその位相揺らぎ特性等を確認することができる。

[0086]

なお、前記実施形態では、フィルタ部25に含まれるディジタルフィルタがFIR型の場合について説明したが、これは本発明を限定するものでなく、入力データを内部の複数の記憶素子にシフトしながら記憶して演算を行う構造のディジタルフィルタであればよく、例えばIIR型の場合でも同様に適用することができる。

[0087]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明の請求項1の雑音発生装置は、ディジタルの白色性の雑音信号を発生する白色雑音発生手段と、ディジタル信号を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶し、その複数の記憶素子の記憶内容についての積和演算を行うディジタルフィルタを有し、白色雑音発生手段から出力された雑音信号を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出

力するフィルタ部と、フィルタ部に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手段と、フィルタ部から特性係数に対応した周波数特性の雑音信号が出力されている状態におけるディジタルフィルタの各記憶素子の記憶内容と同等の雑音信号列を、少なくとも装置の動作初期時にディジタルフィルタの各記憶素子に初期設定する初期設定手段とを備えている。

[0088]

このため、動作初期時等に、フィルタ部の内部状態は直ちに定常状態と同一の 状態に設定されるため、特性係数設定手段から設定された特性係数に応じた周波 数特性の雑音信号を速やかに出力させることができる。

[0089]

また、本発明の請求項2の雑音発生装置は、ディジタルの白色性の雑音信号を発生する白色雑音発生手段と、ディジタル信号を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶し、その複数の記憶素子の記憶内容についての積和演算を行うディジタルフィルタを有し、白色雑音発生手段から出力された雑音信号を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出力するフィルタ部と、フィルタ部に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手段と、フィルタ部から出力される雑音信号に予め設定された振幅係数を乗算する乗算器と、乗算器に任意の振幅係数を設定する振幅設定手段と、特性係数設定手段からフィルタ部に設定された特性係数および振幅設定手段の振幅係数とに基づいて、乗算器から出力される雑音信号の特性を求める特性算出手段と、特性算出手段によって求められた雑音信号の特性を表示する特性表示手段とを備えている。

[0090]

このため、出力される雑音を測定することなく、事前にその雑音特性が分かり 、便利である。

[0091]

また、本発明の請求項3のジッタ・ワンダ発生装置は、ディジタルの白色性の 雑音信号を発生する白色雑音発生手段と、ディジタル信号を内部の複数の記憶素 子に順次シフトしながら記憶し、その複数の記憶素子の記憶内容についての積和 演算を行うディジタルフィルタを有し、白色雑音発生手段から出力された雑音信 号を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出力するフィルタ部と、フィルタ部に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手段と、フィルタ部から出力される雑音信号に予め設定された振幅係数を乗算する乗算器と、乗算器に任意の振幅係数を設定する振幅設定手段と、乗算器から出力された雑音信号によって位相変調されたクロック信号を出力する周波数シンセサイザと、フィルタ部から特性係数に対応した周波数特性の雑音信号が出力されている状態におけるディジタルフィルタの各記憶素子の記憶内容と同等の雑音信号列を、少なくとも装置の動作初期時にディジタルフィルタの各記憶素子に初期設定手段とを備えている。

[0092]

このため、動作初期時等に、フィルタ部の内部状態は直ちに定常状態と同一の 状態に設定されるため、特性係数設定手段から設定された特性係数に応じた周波 数特性の雑音信号で位相変調されたクロック信号を速やかに出力させることがで きる。

[0093]

また、本発明の請求項4のジッタ・ワンダ発生装置は、ディジタルの白色性の 雑音信号を発生する白色雑音発生手段と、ディジタル信号を内部の複数の記憶素 子に順次シフトしながら記憶し、その複数の記憶素子の記憶内容についての積和 演算を行うディジタルフィルタを有し、白色雑音発生手段から出力された雑音信 号を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出力す るフィルタ部と、フィルタ部に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手 段と、フィルタ部から出力される雑音信号に予め設定された振幅係数を乗算する 乗算器と、乗算器に任意の振幅係数を設定する振幅設定手段と、乗算器から出力 された雑音信号によって位相変調されたクロック信号を出力する周波数シンセサ イザと、特性係数設定手段から設定された特性係数および振幅設定手段から設定 された振幅係数に基づいて、乗算器から出力される雑音信号または周波数シンセ サイザから出力されるクロック信号の特性を求める特性算出手段と、特性算出手 段によって求められた特性を表示する特性表示手段とを備えている。

[0094]

このため、出力される雑音やクロック信号を測定することなく、事前にその特性が分かり便利である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施形態の雑音発生装置の構成を示すブロック図

【図2】

実施形態の要部の構成を示すブロック図

【図3】

実施形態の要部の構成を示すブロック図

【図4】

実施形態の動作を説明するためのブロック図

【図5】

実施形態の要部の変形例を示すブロック図

【図6】

図5の変形例の動作を説明するためのタイミング図

【図7】

図5の変形例の動作を説明するための図

【図8】

図5の変形例の動作を説明するための図

【図9】

本発明の実施形態のジッタ・ワンダ発生装置の構成を示すプロック図

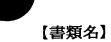
【図10】

ディジタル方式の雑音発生装置の概略構成を示すブロック図

【符号の説明】

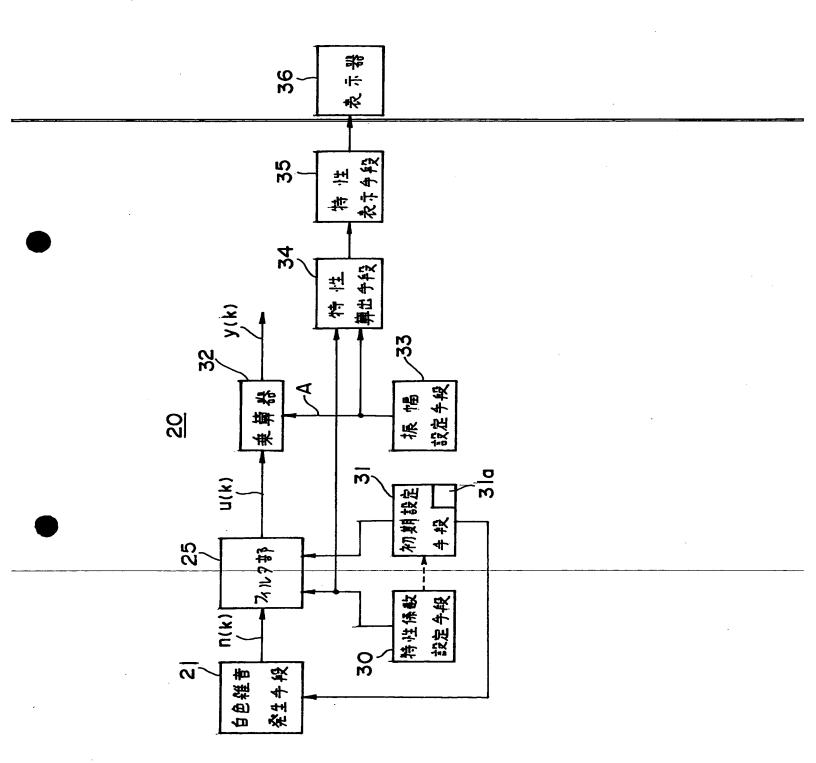
- 20 雑音発生装置
- 21 白色雜音発生手段
- 22 (1)~21 (N) 擬似ランダム信号発生器
- 23 制御回路
- 25 フィルタ部

- 26 ディジタルフィルタ
- 27(1)~27(M) 記憶素子
- 28 (1)~28 (M+1) 乗算器
- 29 加算器
- 30 特性係数設定手段
- 3 1 初期設定手段
- 32 乗算器
- 33 振幅設定手段
- 34、34′ 特性算出手段
- 35 特性表示手段
- 3 6 表示器
- 41 分波回路
- 42(1)~42(P) 1/2デシメート回路
- 43 重み付け回路
- 44(1)~44(P+1) 乗算器
- 45 合成回路
- 46(1)~46(P) サブバンド合成器
- 50 ジッタ・ワンダ発生装置
- 51 周波数シンセサイザ

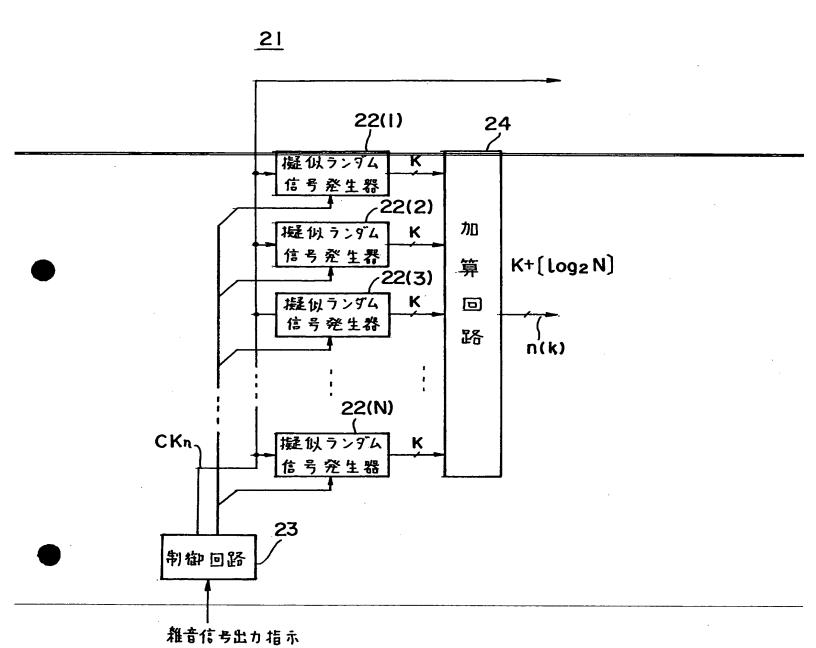


図面

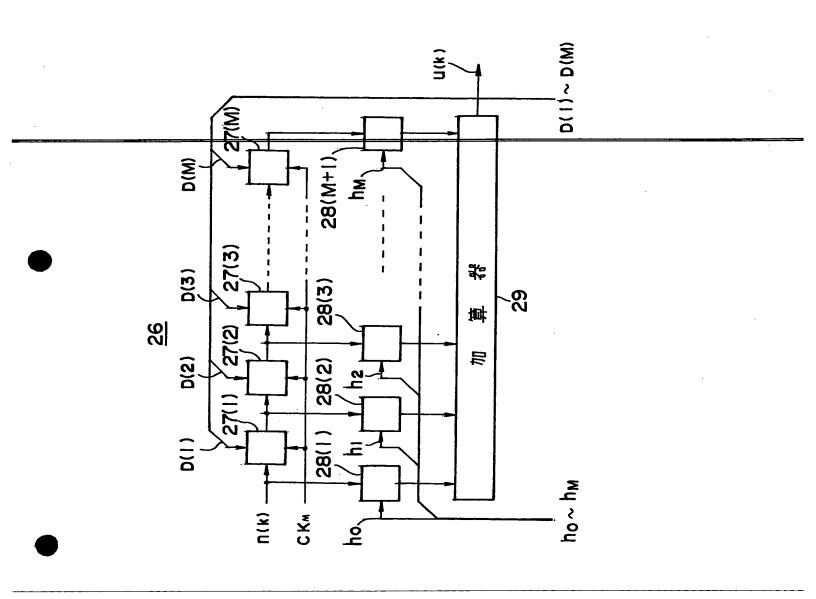
【図1】



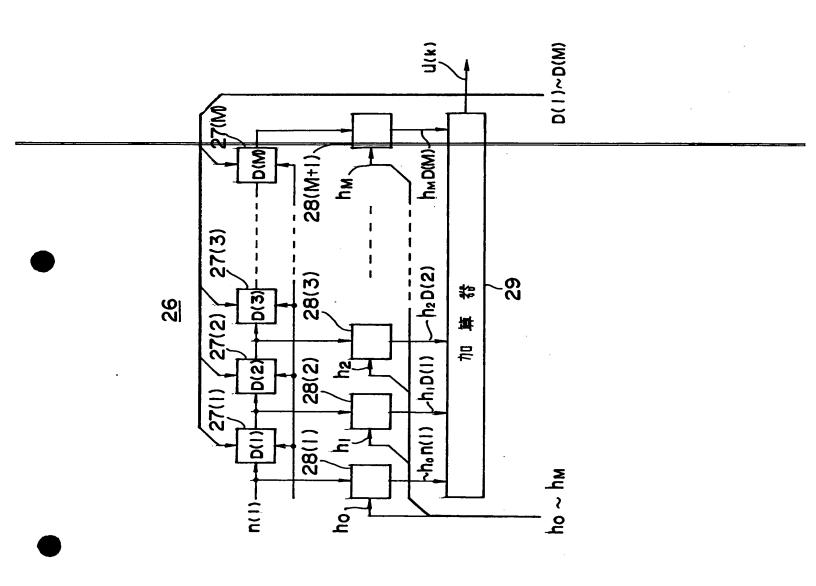




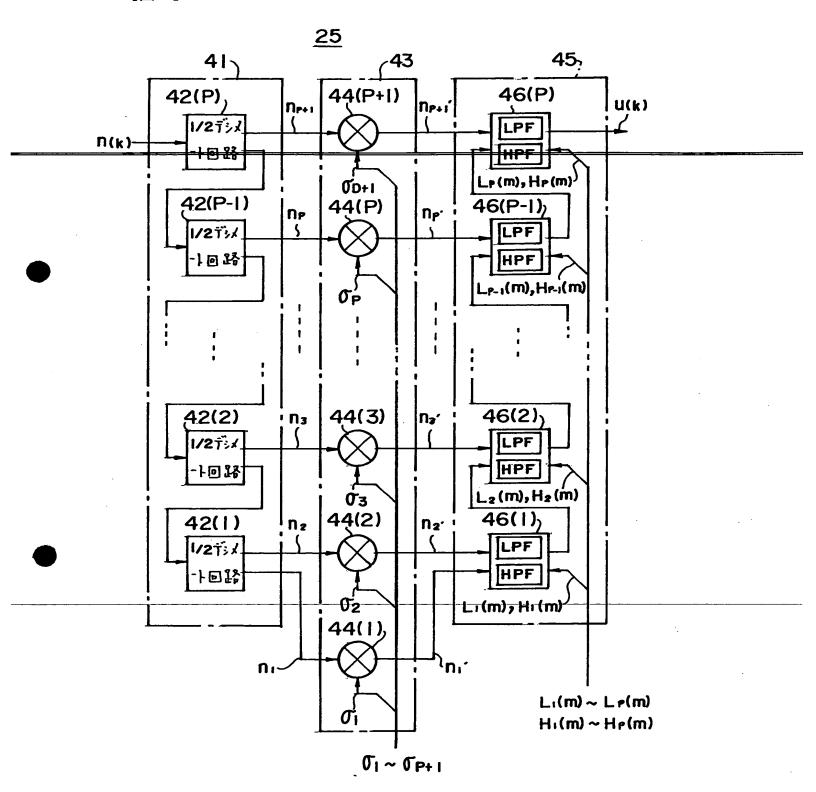








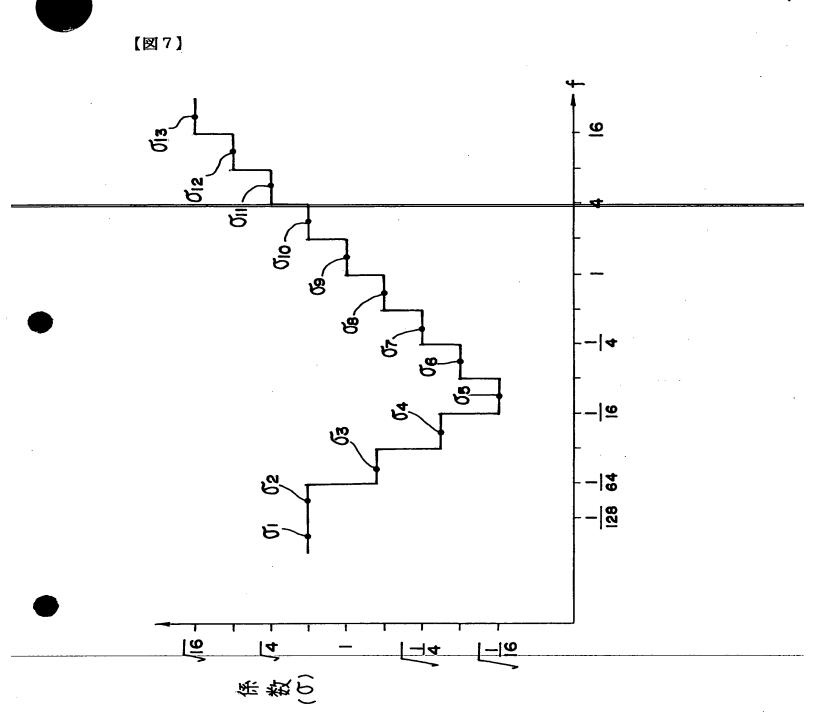


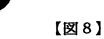


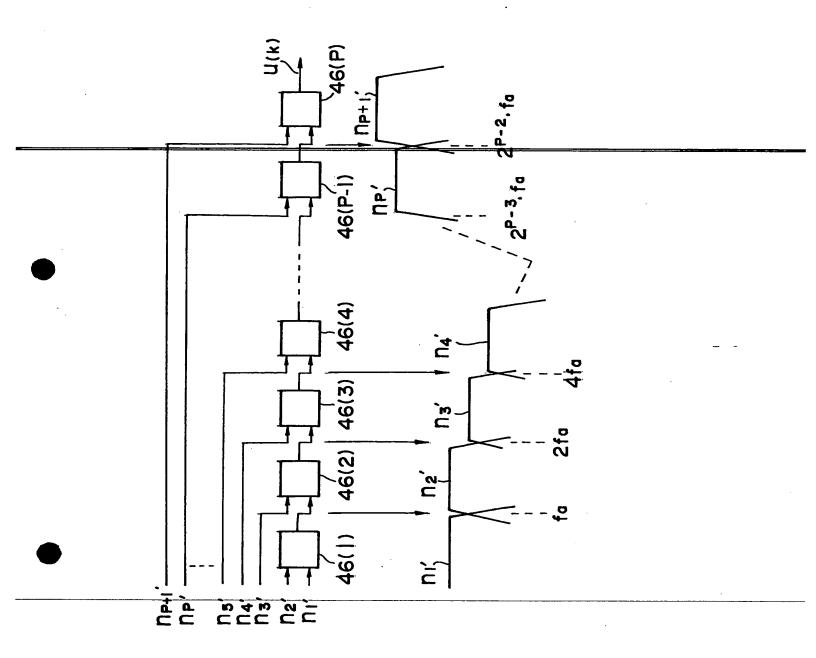


·) n(17)n(18)) n(17)	-	n(18)						n(I6)	·
	(S)		n(15)		n(14)	i i	n(12)			np-3		
	3) n(14) n(n(13)				C					
	(11) n(12) n((11)u		n(10)	-	,		n(8)			
)n(OI)n (6		n(9)						:	•		·
	(7)n(8)n(n(7)		n(6)		n(4)	ΠP-2 ₂				·
	(5) n(6) n		n(5)			NP-1)						
	n(4)n		n(3)		n(2)	C						
ח(א)	n(1) n(2) n(3) n(4) n(5) n(6) n(7) n(8) n(9) n(10) n(11) n(12) n(13) n(14) n(15) n(16) n(17) n(18)	n _{P+1)}	וטע	ne,								
	ô		P		<u> </u>		-		<u></u>		<u> </u>	

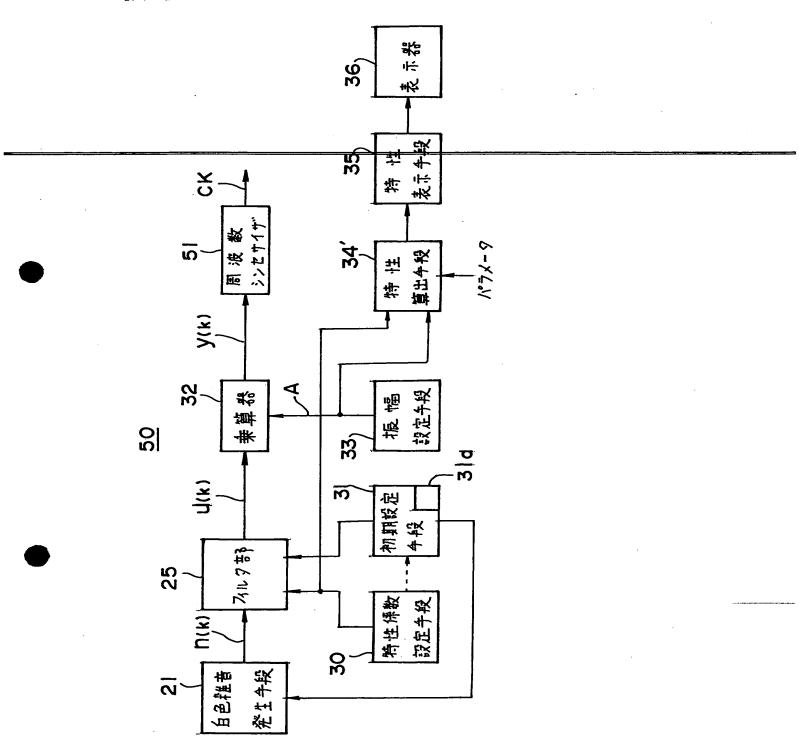
6



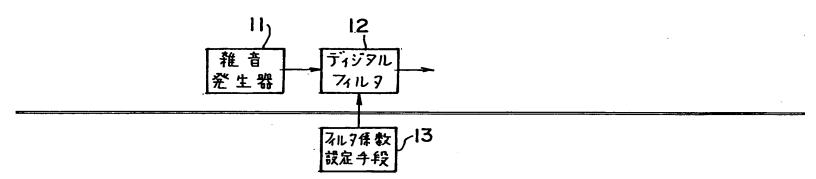












【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 動作初期時等に所望特性の雑音信号を速やかに出力させる。

【解決手段】 ディジタルの白色性の雑音信号を発生する白色雑音発生手段21 と、ディジタル信号を内部の複数の記憶素子に順次シフトしながら記憶し、その 複数の記憶素子の記憶内容についての積和演算を行うディジタルフィルタを有し

、白色雑音発生手段21から出力された雑音信号を予め設定された特性係数に対応する周波数特性の雑音信号に変換して出力するフィルタ部25と、フィルタ部25に対して任意の特性係数を設定する特性係数設定手段30と、フィルタ部25から特性係数に対応した周波数特性の雑音信号が出力されている状態におけるディジタルフィルタの各記憶素子の記憶内容と同等の雑音信号列を、少なくとも装置の動作初期時にディジタルフィルタの各記憶素子に初期設定する初期設定手段31とを備えている。

【選択図】

図 1



認定・付加情報

特許出願の番号

平成11年 特許願 第367209号

受付番号

59901262865

書類名

特許願

担当官

第三担当上席 0092

作成日

平成12年 1月 4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成11年12月24日

出願人履歴情報

識別番号

[000000572]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区南麻布5丁目10番27号

氏 名 アンリツ株式会社